

Difracción de Rayos-X

De lo científico a lo tecnológico

Fidel Sánchez Riaño

Innovation and Sales Manager
Bruker Española S.A. (Madrid)

11 de mayo 2017, jueves
10 h

Sala de Grados, Edif. D. Facultad de Ciencias

CONFERENCIA
PROGRAMA EXPERTIA

ISQCH

Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea

 **CSIC**
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

 **Universidad
Zaragoza**
1542

 **BRUKER**

Colabora:
 **Facultad de Ciencias
Universidad Zaragoza**

Difracción de Rayos-X

De lo científico a lo tecnológico

El seminario pretende realizar una revisión de la infraestructura científica actualmente disponible dedicada a los estudios de difracción de rayos X, tanto en muestras mono- como policristalinas. Se pretende repasar los avances instrumentales acaecidos en los últimos años que amplían las posibilidades para la obtención de información estructural por difracción.

El seminario comenzará con un muy breve repaso de las bases conceptuales de la difracción, para a continuación mostrar ejemplos sencillos de aplicaciones. Sobre la base de la experiencia acumulada en nuestra empresa, abordaremos la descripción de las novedades instrumentales en fuentes de rayos X, en dispositivos de control óptico de la radiación, goniómetros, criostatos, detectores y programas para el tratamiento de datos.

Fidel Sánchez

Fidel Sánchez es ingeniero superior en sistemas electrónicos. Durante más de 30 años, ha sido responsable del Departamento de rayos X de Bruker Española, siendo coordinador de la canalización de la innovación demandada por los usuarios, así como de la innovación desarrollada por la filial internacional de la compañía. Fidel Sánchez viene participando en los desarrollos de nueva instrumentación de la marca Bruker, líder mundial en equipamiento científico para la difracción.